



NEWS RELEASE

詳細については、以下までお問い合わせください。

(株)半導体理工学研究センター(STARC)
開発第1部 先端コアプログラム
電話：045-478-3300(代表)
<https://www.starc.jp/other/contactus-j.html>
FAX：045-478-3299
住所：〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-2
友泉新横浜ビル 5F

アトレンタ株式会社 営業部
電話：045-470-3803(代表)
<https://www.atrenta.jp>
FAX：045-470-3805
住所：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-17-5
Benex, S-2 ビル 9F

STARC が Atrenta とツール品質向上プログラムを開始

神奈川県横浜市 - 2010年1月27日 -株式会社 半導体理工学研究センター

(STARC) と Atrenta, Inc. (Atrenta) は、STARC で開発した EDA ツール評価用データベース (以下、QA データベース) を活用した品質向上プログラムを実施し、その有効性を確認しました。

STARC では、テストケースとよぶ評価仕様書や評価モチーフなどから構成した QA データベースを提供しました。Atrenta は、同社製 SpyGlass の出荷テストにおいて、QA データベースに基づいた評価を行うことにより、改版時に発生する不具合の早期発見、およびその改修を行うことで製品の品質向上が可能となりました。

更に、Atrenta での評価実施結果を STARC へレポートする仕組みを立ち上げました。このレポート（以下、QA レポート）には、評価結果（不具合の有無、不具合の場合は内容と改修予定情報）と QA データベースに対応した仕様変更情報も含まれていることから、変更内容等を確認することにより、設計者がツールを設計現場へ導入するかどうかの判断を円滑に行うことが可能となりました。

STARC 西口信行（執行役員兼開発第一部長）は、「Atrenta へ QA データベースの組込みを依頼した 1.5 年前から現在に至る試行では、組込み以前に見られたツール改版時のリグレッションが、一切確認されなくなった。

また、今回、QA レポート作成までの協力を Atrenta 社から得られたことで、STARC クライアントへの必要情報の展開が適時おこなえるようになり、クライアントでの改版時に行う確認作業が削減された。」と効果を感じています。

Atrenta Mike Gianfagna（vice president of marketing）は、「STARC クライアント各社が合意した設計者視点の評価項目を体系化した QA データベースを活用することにより効率よく製品品質の維持が行え、市場における不具合を減少させることが出来た。また、QA レポートのシェアにより、ユーザ・サポートがより円滑に行えるようになった。」とコメントしています。

STARC と Atrenta では、今回の効果を確認したことにより、評価機能の追加や適用 EDA ツールを拡大することによって、ツール品質の維持および評価・サポートコストの削減を更に推進していきたいと考えております。

(株)半導体理工学研究センターについて

(株)半導体理工学研究センター(STARC)は、平成 7 年 12 月に日本の半導体メーカー11 社の出資で設立され、国内大学の半導体関連研究基盤を拡大するため、大学と半導体産業界との共同研究を推進するとともに、SoC設計技術者育成、SoC設計効率向上を目指した設計基盤技術の共同開発を行っています。さらに、活動成果を出資企業へ移転しその事業に寄与するとともに、技術標準として公開あるいはパートナー企業へライセンス供与して製品化し、日本の半導体産業の競争力向上に貢献しています。詳しくはSTARCのホームページ(www.starc.or.jp) をご覧下さい。

Atrenta について

AtrentaはIC設計フロー全体を通じて設計効率を劇的に改善するEarly Design Closure®ソリューションで業界をリードしています。顧客はRTL設計早期にリネーティング、CDC（クロック・ドメイン・クロッシング）、消費電力予測及び削減、DFT（Design for Test）、タイミング例外を含む設計制約生成および検証、RTLプロトタイピングを含むAtrentaの各種ツールおよび手法を使うことにより設計を最適化します。Atrentaにより最適化されたRTLはチップインテグレーション、インプリメンテーションおよび検証の段階で最大 30%の効率性アップを可能にします。Atrentaのユーザー数は 150 社を超え、世界の大手半導体メーカー上位 10 社も含まれています。詳しくは、 www.atrenta.com を参照してください。

Atrenta、Atrenta Logo、SpyGlass、Early Design Closure は Atrenta Inc.の登録商標です。

本プレス・リリースは将来を見通した内容が含まれています。それらの見通しは予告無しに変更される事がありますので、予め御了承下さい。